(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.[5]
G01R 31/26

(11) 공개번호 특1992-0021995
(43) 공개일자 1992년12월19일

(21) 출원번호 특1992-0008060
(22) 출원일자 1992년05월13일
(30) 우선권주장 91-110483 1991년05월15일 일본(JP)
(71) 출원인 가부시끼가이샤 아드반테스트 오오우라 히로시
일본국 도오꾜오도 네리마꾸 아사히쪼오 1쪼오메 32반 1고오
(72) 발명자 니시우라 쥰지
일본국 도오꾜오도 네리마꾸 아사히쪼오 1쪼오메 32반 1고오 가부시끼가이샤 아드반테스트 내
(74) 대리인 라기상, 장용식

심사청구 : 있음

(54) IC 시험장치

요약

내용 없음.

대표도

도1

명세서

[발명의 명칭]

IC 시험장치

[도면의 간단한 설명]

제1도는 입출력 핀을 갖는 복수와 피시험 IC소자를 동시에, 직접 구동으로 동시 시험할수 없음을 도시하는 볼록도,

제3도는 본 발명 실시예의 주요부를 예시하는 블록도,

제4도는 드라이버(21)의 출력상태예를 예시하는 도면.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

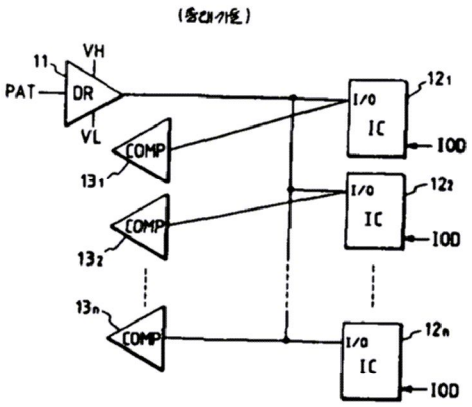
청구항 1

이들 입출력핀으로부터의 각 출력을 각각 별도의 비교기에 수용하여 시험을 행하는 IC시험장치에 있어서, 시험패턴데이타와 입력 혹은 출력을 결정하는 입출력제어신호가 부여되고, 상기 입출력제어신호가 입력을 표시하는 상태에서 상기 시험패턴데이타에 따른 2개의 레벨의 어느한쪽을 출력하고, 상기 입력제어신호가 출력을 나타내는 상태에서 제3레벨을 출력하는 드라이버 수단과, 상기 드라이버 수단의 출력측과 복수의 피시험 IC소자의 각각의 입출력핀과의 사이에 각각 접속된 부하저항과, 상기 복수의 피시험 IC소자의 상기 입출력핀에 각각 접속된 복수의 비교기와, 이들을 구비하는 것을 특징으로 하는 IC시험장치.

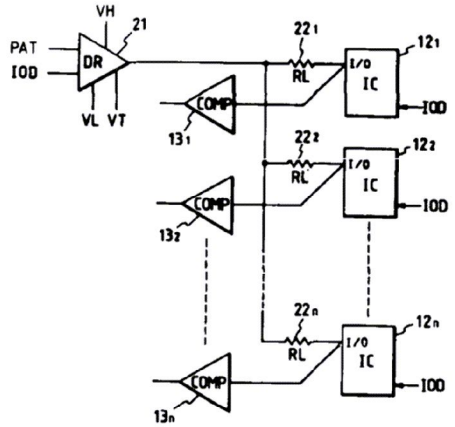
※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면

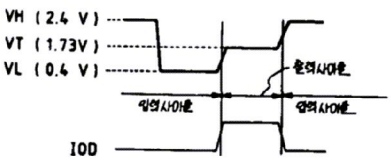
도면1


VH
11
PAT
DR
VL
COMP
131
COMP
132
13n
COMP
I/O
IC
121
IOD
I/O
IC
122
IOD
I/O
IC
12n
IOD

도면3


VH
21
PAT
IOD
DR
VL VT
221
RL
I/O
IC
121
IOD
COMP
131
222
RL
I/O
IC
122
IOD
COMP
132
22n
RL
I/O
IC
12n
IOD
COMP
13n

도면4


VH (2.4 V)
VT (1.73V)
VL (0.4 V)
IOD